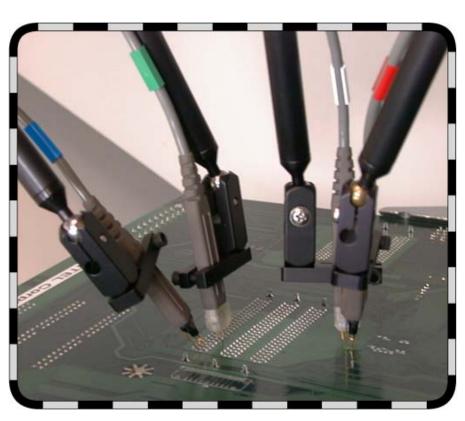
探棒的原理及種類

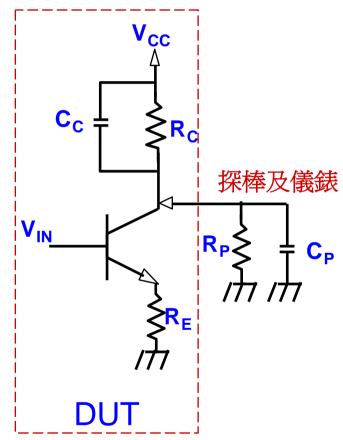
- ▶ 示波器功能的延伸
- 影響量測的準確性
- ▶ 不同的應用, 搭配不同的探棒
- 探棒的種類
 - 電壓
 - 電流
 - 光/電轉換 (O/E)
 - 邏輯
 - 物理量:溫度,壓力...



探棒如何影響測量精確度

- 要得到適當的測量結果,測量附件必須跟儀錶及待測物(DUT)密切配合。須考量的項目包括:
 - 被量測的訊號形式(電壓、電流、邏輯、其他)
 - 訊號頻率內容(DC, Hz, kHz, MHz)
 - 訊號源阻抗(電阻、電容、電感)
 - 實體<u>連接</u>考量(DUT及儀錶)
 - 儀錶<u>輸入阻抗</u> (50 ohm, 1 Mohm, 其他)
 - 儀錶頻寬或上升時間

探棒如何影響測量系統



NOTE: V_{CC} 爲交流接地

不具探棒及儀錶

Gain =
$$\frac{-R_C}{R_E}$$

 $f_0 = \frac{1}{2 \pi R_C C_C}$

具探棒及儀錶

Gain =
$$\frac{-(R_C||R_P)}{R_E}$$

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi (R_C||R_P)(C_C + C_P)}$$

探棒頻寬 V.S.系統頻寬

一 示波器的量測中,探棒是必備的,所以探棒頻寬亦會影響 測量結果,其上升時間影響公式如下:

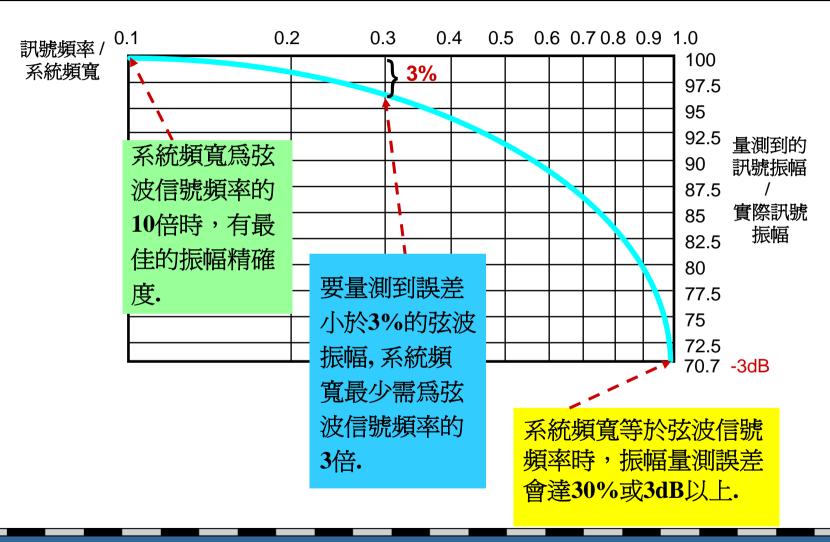
量測値
$$_{\text{L}\text{H時間}} = \sqrt{(訊號_{\text{L}\text{H時間}})^2 + (示波器_{\text{L}\text{H時間}})^2 + (探棒_{\text{L}\text{H時間}})^2}$$

▶ 由於頻寬和上升時間成倒數關係故其頻寬公式如下:

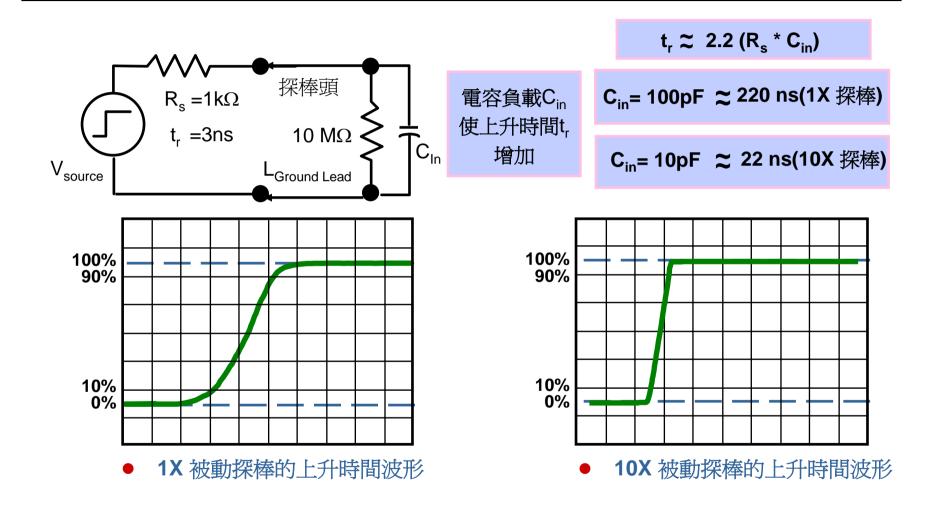
$$\frac{1}{\text{量測頻寬}} = \sqrt{\frac{1}{\text{訊號頻寬}}^2 + \left(\frac{1}{\text{示波器頻寬}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\text{探棒頻寬}}\right)^2}$$

由此式也可看出,示波器及探棒的頻寬越寬,則對量測頻 寬的影響越小,也就是說量測頻寬越接近訊號頻寬

系統頻寬 v.s.正弦波振幅

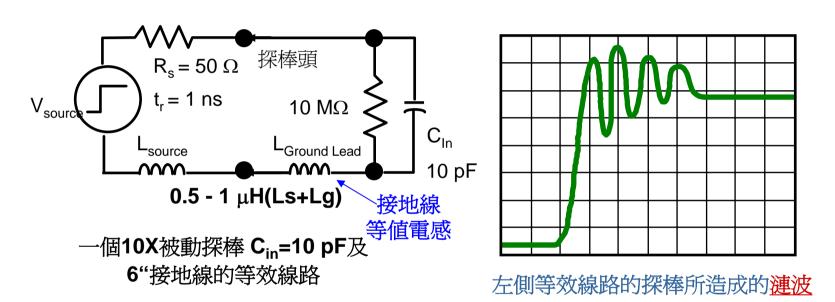


探棒輸入電容及訊號源阻抗



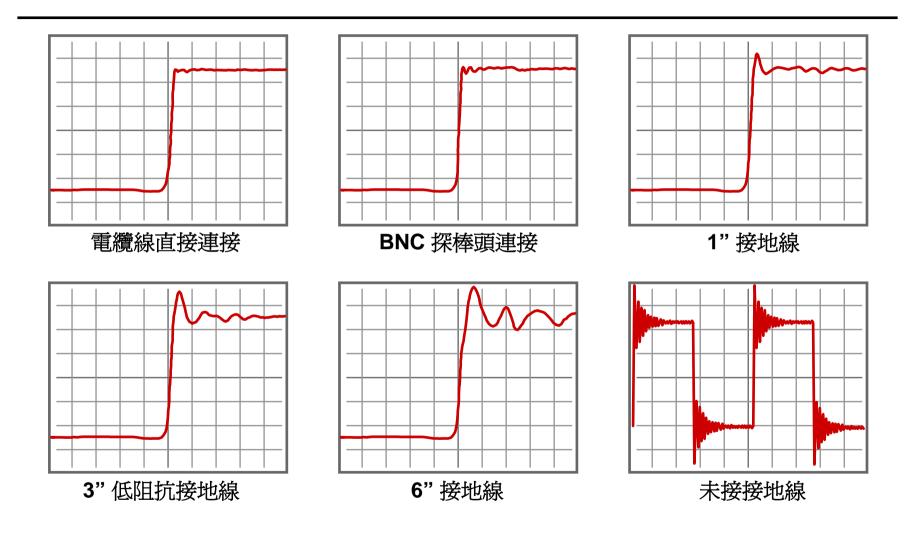
探棒接地線的電感效應

- 電感效應造成<u>阻抗不匹配</u>,頻寬越寬影響越大
- 接地線的長短會影響電感效應的大小,結果會產生脈波訊號的



典型6"接地線探棒
$$=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC}}=50-70~MHz$$
 或 $t_r=7-5~ns$

探棒接地線的電感效應

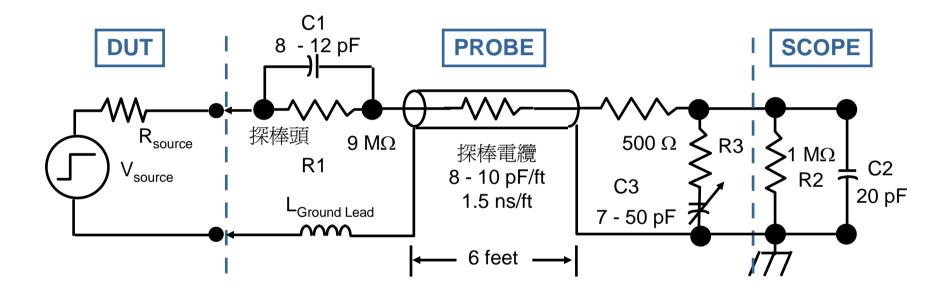


探棒傳輸延遲

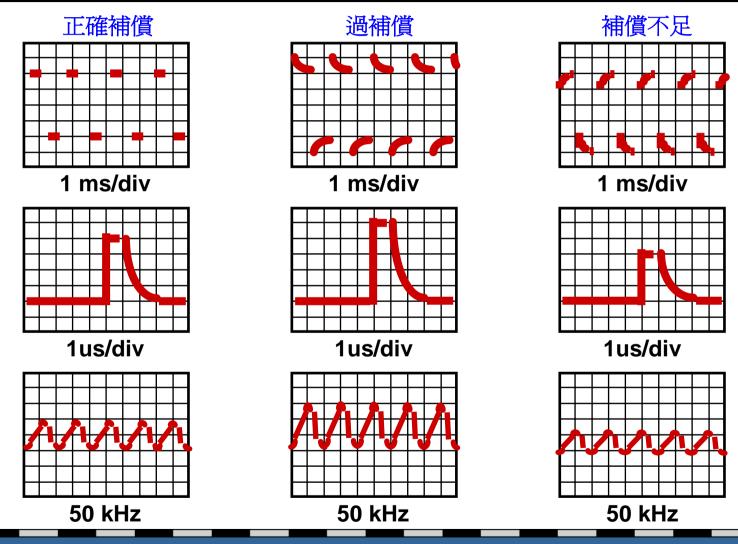
測量時序、功率、及延遲時重要的考量

- ▶ 典型的探棒延遲範圍在 4 ns 到 8 ns
- ▶ 不同的探棒會造成不同的延遲,需用示波器 "<u>deskew</u>"的功能 來消除探棒的延遲
- ▶ 同型探棒間的延遲應越小越好,典型的應在 200 ps 之內

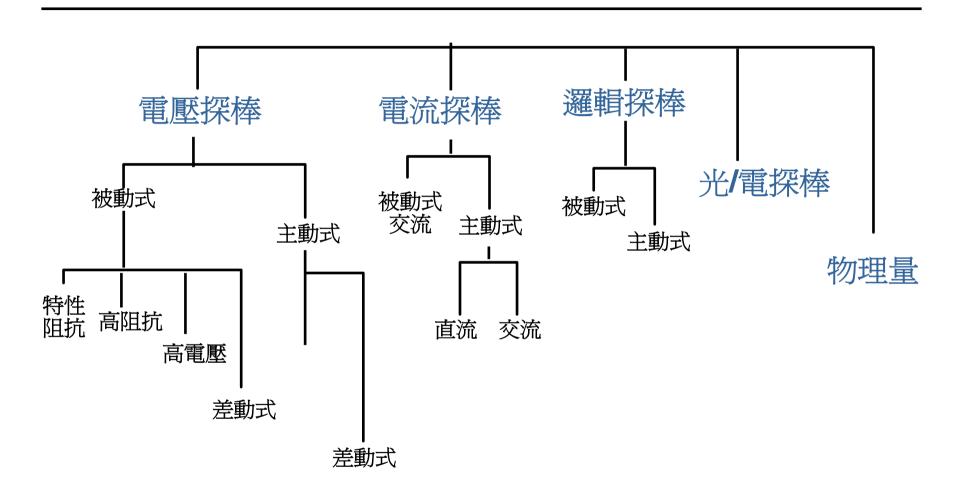
被動探棒的低頻(LF)補償



被動探棒的低頻(LF)補償

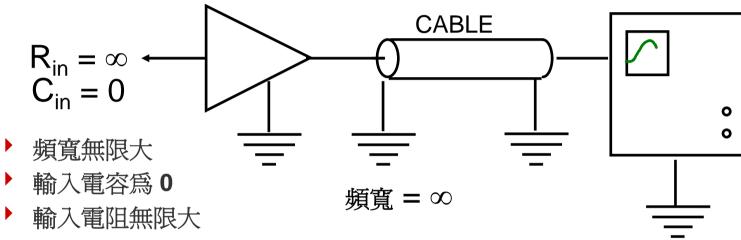


探棒的種類



理想電壓探棒

- 理想的電壓探棒模型
 - ▶ 理想的探棒是沒有負載效應,也就是不對測量造成任何影響

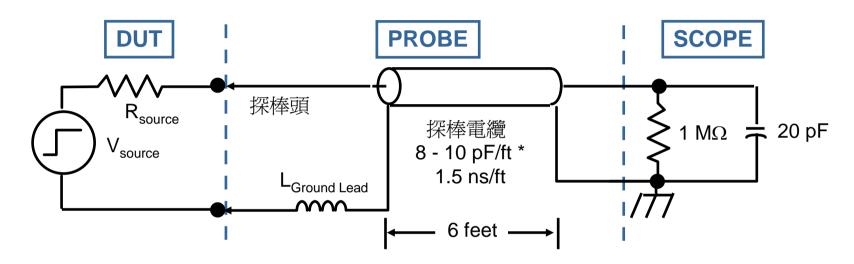


- ▶ 動態範圍無限大(Dynamic Range)
- 1:1衰減
- 無延遲
- ▶ 無相位偏移(Phase Shift)
- 機械結構適合測量應用

電壓探棒典型的規格

型式	頻寬	上升時間	輸入電容	輸入電阻
1X 被動探棒	15 MHz	23 ns	100 pF	1 ΜΩ
10X被動探棒	100 MHz - 500 MHz	3.5 ns - 700 ps	13 pF - 8 pF	10 M Ω
Z0 被動探棒	3 GHz - 9 GHz	120 ps - 40 ps	1 pF - 0.15 pF	500 Ω
主動探棒	500 MHz - 4 GHz	700 ps - 100 ps	2 pF - 0.4 pF	10 MΩ - 100 kΩ

1X 電壓探棒 -- 被動式

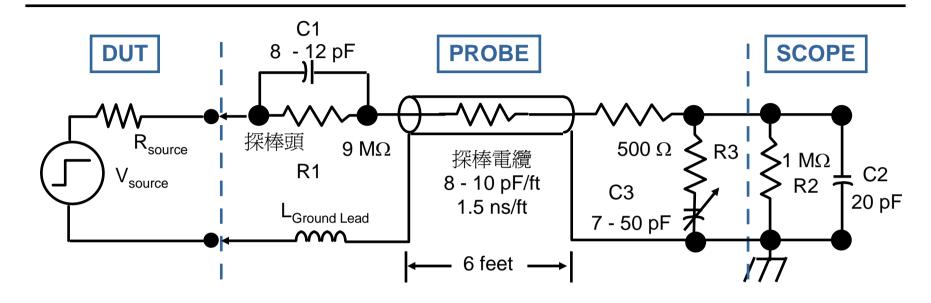


優點:

- 1X 沒有衰減
- 價格便宜

- 高反射量
- 輸入電容太大
- 低頻寬
- * 典型 50 Ω 電纜約有30 pF/ft 的電容量

10X 電壓探棒 -- 被動式

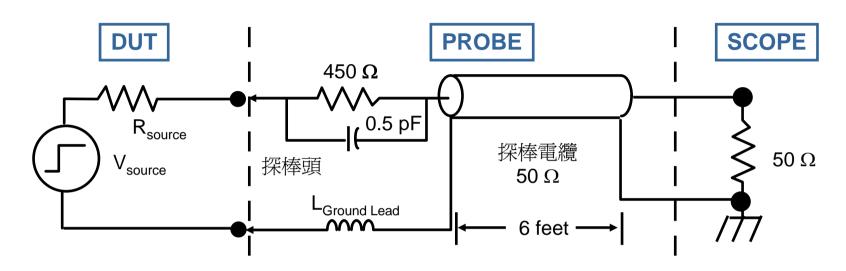


優點:

- 高輸入電阻
- 寬動態範圍
- 價格合理
- 機械結構堅固
- 比1X 探棒的輸入電容低

- 輸入電容仍太高
- 跟50 Ω系統不相容
- 必須補償

50 Ω 10X 電壓探棒--被動式

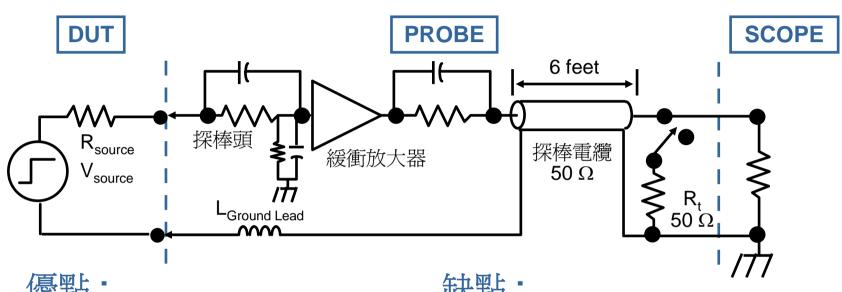


優點:

- 低輸入電容
- 寬動態範圍
- 加上終端電阻跟50 Ω及1M Ω 系統相容
- 無須補償

- 低輸入電阻
- 必須有50 Ω的終端

10X 電壓探棒-- 主動式



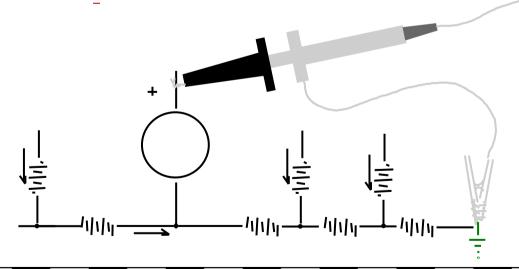
- 優點:
- 低輸入電容
- 寬動態範圍
- 高輸入電阻
- 加上終端電阻跟 50Ω 及 $1M \Omega$ 系統相容
- 無須補償

- 高價位
- 動態範圍有限
- 機械結構較不堅固
- 須額外的電源

何時使用差動式電壓探棒

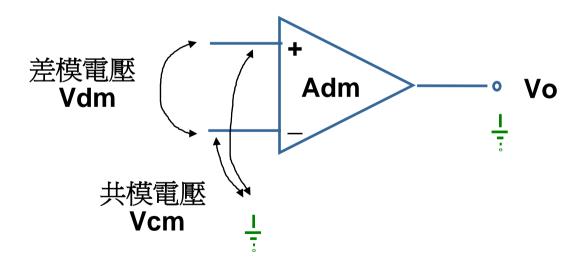
- 不以地點爲參考點
 - 浮動點(Floating)測量
 - <u>平衡(Balanced)</u>訊號
- 地點並不是很好的參考點時
 - 低振幅 (<10 mV): 地點雜訊大於訊號振幅

- <u>高速度 (t_r < 2ns)</u>: 地點離訊號點太遠



共模及差模

- ▶ 共模(Common Mode)電壓 Vcm 及共模增益 Acm:
 - 兩個輸入端對地的電壓差為 Vcm,經過差動放大器後的增益為 Acm
- ▶ 差模(Differential Mode)電壓 Vdm 及差模增益 Adm:
 - 兩個輸入端間的電壓差爲 Vdm ,經過差動放大器後的增益爲 Adm



共模互斥比(CMRR)

► CMRR(Common Mode Rejection Ratio) :

差模增益 Adm跟共模增益 Acm的比值,即

CMRR =Adm/Acm

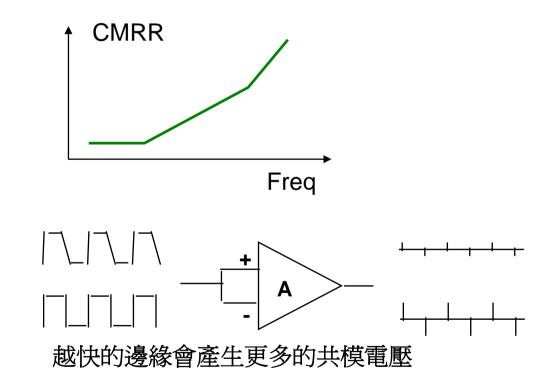
或

dB(CMRR) = 20log(Adm/Acm)

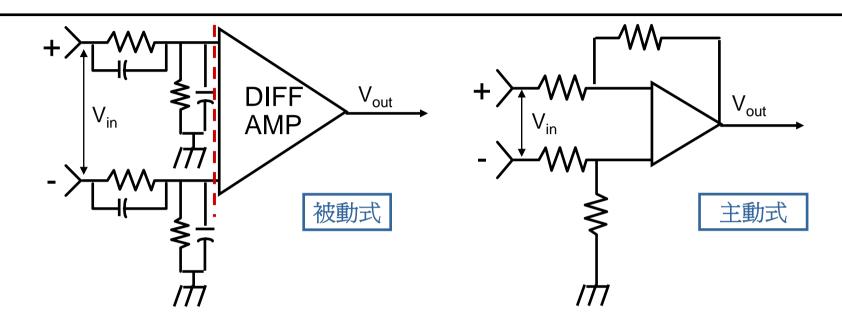
若Acm 趨近於零,則<u>CMRR趨近無限大</u>,代表一理想的差動放大器 所以針對差動式探棒而言CMRR值越大越好

CMRR的規格

- ▶ CMRR值越大越好一般在60dB(1000:1)附近
- ▶ 隨著頻率增加CMRR會逐漸減小

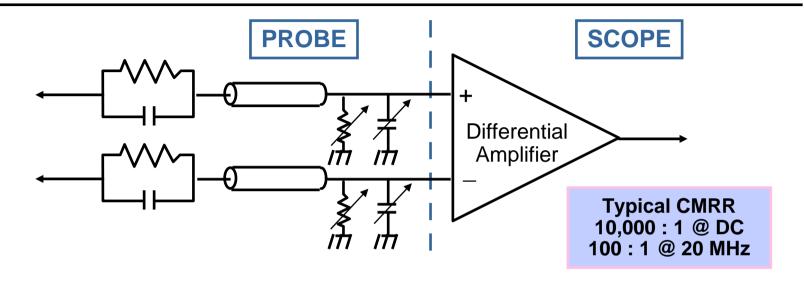


電壓探棒-- 差動式



- 被動差動式探棒必須將兩支探棒的延遲、衰減、及補償,做精準的調校。
- ▶ 假如沒有做精準的調校,CMRR將會嚴重的下降.
- 主動差動式探棒由於具OP放大器做緩衝,因此不須要做這些調校.

電壓探棒--被動差動式

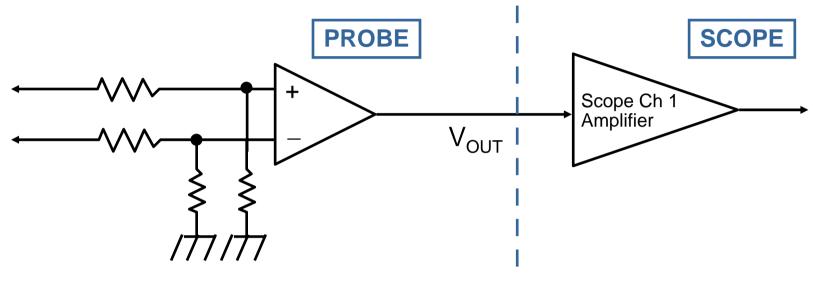


優點:

- 比被動式探棒的CMRR高
- 寬動態範圍
- 機械結構堅固
- 兩支探棒可以作較遠的分離

- 須要兩個不同的輸入
- 跟50 Ω系統不相容
- 須補償

電壓探棒-- 主動差動式



優點:

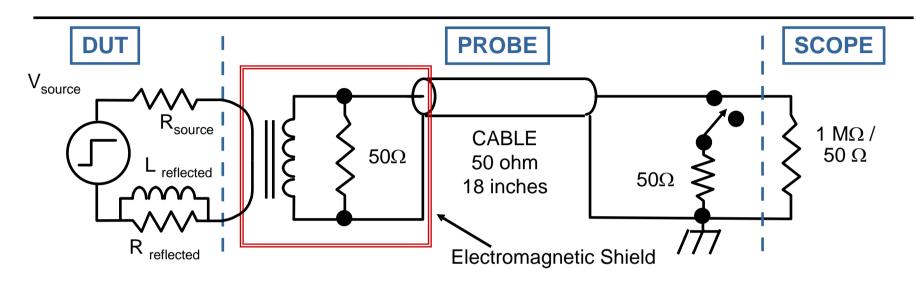
- 低輸入電容
- 比被動差動式探棒的CMRR高
- 跟50 Ω及1M Ω單端(Single-ended)系統相容
- 探棒頭非常小

- 高價位
- 有限的動態範圍
- 須額外的電源

電流探棒的特性

- 探棒的交流反應,依據變壓器的動作,將電流轉爲電壓
- ▶ <u>直流</u>測試,須在變壓器上加一霍爾效應 (Hall Effect)感應器
- ▶ 兩種型式可用:
 - 固定核心(Fixed Core) 須要打開導體(conductor)來連接
 - 分離核心(Split Core) 允許直接附在導體上(clipping around)
- ▶ 以極低的嵌入阻抗(Lreflected & Rreflected),使 DUT的電容性 負載達到最小
- ▶ 提供<u>電子絕緣</u>,允許無參考地點量測

電流探棒--被動式

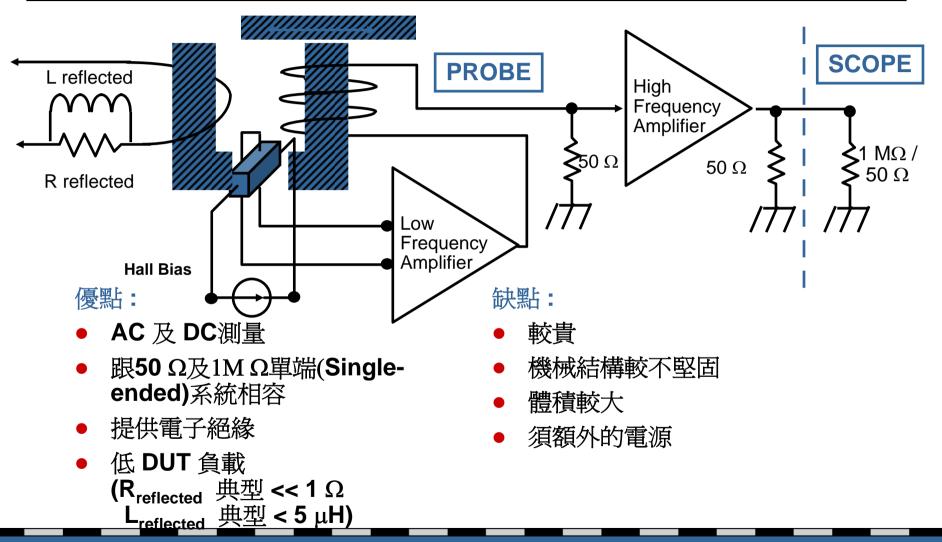


優點:

- 寬的 AC 頻寬
- 價格不貴
- 提供電子絕緣
- 低 DUT 負載
 (R_{reflected} 典型 1 to 2 Ω
 L_{reflected} 典型 5 μH)

- 只能測量 AC
- 固定核心須要打開導體連接
- 直流電會使核心飽和

電流探棒-- 主動式



結論

- 探棒一定有負載
- 被動探棒一定要做補償
- ▶ 系統頻寬包括示波器探棒及待測訊號
- ▶ 精確的測量量測工具的系統頻寬最好是待測訊號的3到5倍
- 盡可能使用低輸入電容及短地線
- 使用適當的連接方式接觸測試點